

JAEA-ISOL用イオン源の開発

原子力機構 長 明彦

- 原子力機構 佐藤哲也、中村暢彦、松田 誠、浅井雅人、 西尾勝久、塚田和明、市川進一、 タンデム加速器グループ
- KEK 宮武宇也、石山博恒、TRIACグループ



H18年度上期実施済み課題

• ウラン標的FEBIADイオン源

運転毎に"当たり外れ"がある(H17年度)

組立手順でターゲットにコールドスポットができることが判明(H18年2月)

→安定した動作・性能が再現することを確認(H18/6/20) 照射条件の多少の変化では収量に変化がないことを確認

• ウラン標的表面電離型イオン源

 ¹⁴⁰Csイオン化効率14%→アルカリ、アルカリ土類元素への適用を確認 ln(沸点2072℃、IP=5.786eV)の単離に適用できるはず
¹²⁶In(T_{1/2}=1.6s)イオン化効率0.08%(核融合-蒸発反応での実績0.8%)
→アイオナイザーの小型化・高温化で0.8%を達成(H18/6/15)



ウラン標的表面電離型イオン源の改良





ウラン標的表面電離型イオン源の改良

改良によるイオン化効率改善

(強度は標的量320mg/cm², 陽子ビーム強度100nAで規格化)

| 核種 | 強度(ions/s) | | 効率 | |
|--------------------|-----------------------|---------------------|---------|-------|
| | Ver.1 | Ver.2 | Ver.1 | Ver.2 |
| ^{126g} In | 2×103 | 1.5×10^{4} | 0.000/ | 0.8% |
| ^{126m} In | $2 \times 10^{\circ}$ | 1.7×10^{4} | 0.08 /0 | |
| ¹⁴³ Cs | 2×10^{4} | 1.1×10^{5} | 4% | 23% |
| ¹⁴³ Ba | 2×10^{3} | 2.8×10^{5} | 0.2% | 28% |



Inビームの高純度化



U-SISで核反応で生成したIn同位体をイオン化する場合、同時に生成するAg, Cd, Sn などの同重体はイオン化ポテンシャルが高いため蒸気圧が高くてもほとんどイオン化されない。→高純度のInビームが得られる。

| | 47Ag | 48Cd | 49In | ₅₀ Sn |
|-------|-------|-------|-------|------------------|
| IP/eV | 7.576 | 8.994 | 5.786 | 7.344 |
| | | | | |

U-FEBIAD, U-SISでイオン化、質量数124で質量 分離したビームの y 線スペクトル。

▼は¹²⁴Cdのβ壊変に伴うγ線、それ以外は^{124m,g}Inの β壊変に伴うγ線である。



Inビームの高純度化

| Nuclide | U-FEBIAD | U-SIS | Ratio(U-SIS/U-FEBIAD) |
|--------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 122 In(T _{1/2} =10.5s) | 8.1×10^{4} | 4.2×10^{4} | 0.52 |
| 122 In(T _{1/2} =1.5s) | 2.2×10^{5} | 1.0×10^{4} | 0.47 |
| 126 In(T _{1/2} =1.64s) | 2.6×10^4 | 1.6×10^{4} | 0.61 |
| 126 In(T _{1/2} =1.6s) | 2.4×10^{4} | 1.4×10^{4} | 0.56 |

今のところ、ビーム強度はU-FEBIADが2倍程度勝っているが、 ビーム純度はU-SISが優れている。





実験からの要望がある^{131、132}In(T_{1/2}~200ms)などに適用するには 少なくとも高温化が必要





Temperature / K

イオン源からのIn放出に係わるDelay half-lifeの温度依存性

イオン源温度上昇により放出時間を短縮することが可能である。



イオン源からの放出時間測定(In)



JAEA-ISOLとORNL-HRIBFで得られる Inビーム強度の半減期依存性。比較の ため強度は規格化してある。



U-SIS今後の開発





U-SISではFilament-Ionizer間に400V程度の電位差を印加し、熱 電子による電子衝撃で加熱を行っている(SI mode)。Ver.3 では Heat shield を強化すると共に、Heat shieldをFilamentと同電位にす る運転モード(EI mode)が可能である。EI modeでは Heat shield-Ionizer先端間で電子衝撃が発生する。 →Ionizer先端の高温化と電子衝撃によるイオン化機構の付加



U-SIS Ver.3 オフライン試験で観測されたイオン種と電流

| | Ver.3 EI mode | Ver.3 SI mode |
|----------------|---------------|---------------|
| 観測したイオン種と電流 | | |
| Ba^+ | 950 nA | 200 nA |
| Ba^{2+} | 300 nA | 6.8 nA |
| $A=28(N_2^+?)$ | 160 nA | |
| 運転状態 | | |
| EB: | 395V/0.26A | 450V/0.21A |
| Filament-1 | 4.6V/35A | 4V/36.8A |
| Filament-2 | 7V/36.6A | 7.3V/38.1A |
| Total power | 520W | 520W |

表面電離のイオン化機構では本来不可能な、多価イオンや高イオン化ポテンシャル 物質のイオン化がオフライン試験EI mode運転で確認できた。





SI modeでのイオン化傾向は、Ver.2などの運転で見られる傾向と同じである。

EI mode では比較的低いTotal powerでイオン化が確認できており、低温で蒸気圧が低い段階でもイオン源引き出し孔からでた中性ビームを電子衝撃によってイオン化していると考えられる。



オンライン試験におけるVer.2とVer.3の比較

| | Ver.2 | | Ver.3 | |
|------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Mass | Cs | Ba | Cs | Ba |
| 143 | 2.4×10^{5} | 5.9×10^{5} | 7.9×10^{4} | 6.8×10^4 |
| 145 | 1.5×10^{3} | 2.9×10^{5} | 1.5×10^{3} | 5.9×10^{3} |

Ver.3のオンライン試験において、オフライン試験で観測された多価イオンの引き出しやEI modeによるイオン化効率の向上は観測されず、どちらかというと一般的な表面電離イオン源より能力的に劣る結果しかえられていない。

オンライン試験時のイオン源構成はオフライン試験時から若干の変更があり、現 在考慮している要素以外にオフライン試験でのイオン源性能に寄与しているも のがある可能性もあるため、Ver.3の方向での開発は進めていく予定である。



今後の開発方向

 ウラン標的表面電離型イオン源
ヒートシールドの強化+電子衝撃によるイオン化機構の付加 オフラインで多価イオンが出るなど面白い挙動を示したが、 オンラインでは表面電離型イオン源としてしか動作しなかった。 (H18/7/7,11 陽子ビーム加速開発でテスト)
→開発方向を検討中 収量確認中にA=136で~520keV単-γ線を観測
^{136m}Cs(T_{1/2}=19s)のIT(8⁻→5⁺、E3)? 半減期以外の壊変データなし
ウラン標的FEBIADイオン源の製作開始

→ターゲットなどからの離脱時間の促進・短寿命核への適用拡大 標準ガス(Xe)のイオン化効率~20%(GSIなどの実績の約半分) →運転環境(真空等)の見直しによる効率向上



^{136m}Csの核異性体遷移の発見

A=136でのγ線スペクトル(^{136m}Cs) Eγ=518.0±0.1keV, 105keV, 413keV





観測されたγ線、KX線の壊変曲線

2006/08/07 Decay curve of 518 keV γ -ray



A=136で質量分離した後、測定したγ線 スペクトル中には、518keVγ線と、Cs KX 線が確認された。各々の壊変曲線を作 成し半減期を求めた。518keV T_{1/2}=17.3(3)s、Cs KαX T_{1/2}=17.9(15)s となった。^{136m}Csの半減期の報告値は 19(3)sであり、¹³⁶Cs基底準位にβ壊変す る核種はないことから、518keVγ線は、 ^{136m}Csの核異性体遷移に伴うγ線である と判断される。 微弱な遷移である105keV, 413keVにつ いても概ね20秒程度の半減期が確認で

きた。



内部転換係数の決定





壊変図式

